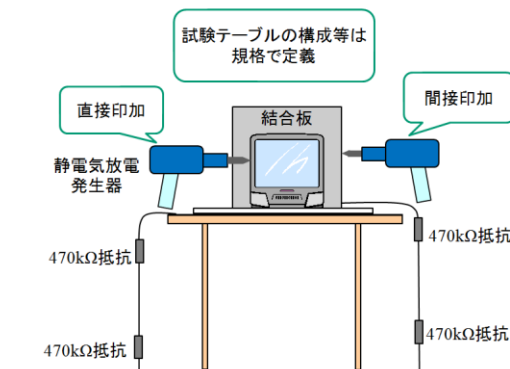


23. 静電気放電イミュニティ試験

静電気放電を受けた時の電子機器の性能を評価
静電気放電を受ける可能性のある表面部分に印加



福島県ハイテクプラザ EMC-ロメモ23

静電気放電イミュニティ試験は、スイッチ、筐体等、人の手が触れる可能性がある部分に対して行います。(直接印加)

金属の棚やシステムラック等の中に設置される供試装置は、装置が直接静電気放電を受けることはありませんが、周囲の金属棚等に放電された静電気により、間接的に影響を受けることがあります。このような場合が想定される時は、その状態を模擬した試験を行います。(間接印加)

JIS C 61000-4-2 によれば、直接印加、間接印加はそれぞれ次のように定義されています。

直接印加: 供試装置に直接放電させる印加

間接印加: 供試装置の近くの物体への、人体からの放電を模擬するために、供試装置に近接した結合板に放電させる印加

直接印加は、人が触れる可能性のある部分すべてに対して行い、放電方法には下記の二種類があります。

接触放電法->静電気放電発生器の電極を供試装置に接触させた状態で、静電気放電発生器内のスイッチで放電

気中放電法->静電気放電発生器の電極を供試装置に近づけながら、火花(アーク放電)によって供試装置に放電

間接印加は、静電気放電発生器の電極を結合板に接触させた状態で放電させますので、印加方法としては接触放電法のみになります。